04:12

Исследование характеристик поперечного объемного разряда в смеси $Ne-SF_6-C_6H_{14}$

© А.К. Шуаибов, А.И. Миня, З.Т. Гомоки, Л.Л. Шимон

Ужгородский национальный университет, 88000 Ужгород, Украина e-mail: ishev@univ.uzhgorod.ua

(Поступило в Редакцию 26 декабря 2006 г.)

Приведены результаты исследования электрических и эмиссионных характеристик плазмы поперечного объемного разряда в смесях неона с молекулами элегаза и пропана при общем давлении $3-12\,\mathrm{kPa}$. Изучены пространственные характеристики разряда, спектры излучения плазмы и диапазоне $130-550\,\mathrm{nm}$, осциллограммы напряжения и тока поперечного объемного разряда, а также выход углеродсодержащего сырья, получаемого при распаде пропана при разных давлениях и составах смеси Ne-SF₆-C₆H₁₄.

PACS: 52.80.-s

Исследование плазмы поперечного объемного разряда (ПОР) в газовых средах на основе элегаза и водород-содержащих соединений актуально в связи с применением этих молекул в химических лазерах, работающих на колебательно-вращательных переходах молекул НГ и НD. Спектр такого лазерного излучения попадает в окно прозрачности атмосферы и представляет значительный интерес для различных применений. Поэтому в последнее время интенсивно изучаются эти химические лазеры как в экспериментальном плане [1,2], так и на теоретическом уровне [3,4].

Диагностика отработанной газовой смеси нецепного HF-лазера с инициированием поперечным объемным разрядом химической реакции в смеси SF_6-H_2 проводилась в инфракрасной области спектра [5]. Эксперименты показали, что в этой смеси образуются молекулы SF_4 (линии поглощения в спектральном диапазоне $532-892\ {\rm cm}^{-1}$), а при наличии в исходной смеси небольших примесей паров воды в смеси эффективно образуются молекулы SOF_2 , SOF, SOF_4 и SO_2F_2 . Данные по анализу $V\Phi$ -излучения плазмы поперечного разряда на смесях элегаза с углеродсодержащими молекулами, которые являются наиболее эффективными носителями водорода в химических лазерах, отсутствуют, поэтому эмиссионная диагностика вышеуказанных смесей является актуальной.

Кроме того, плазма ПОР на основе молекул пропана и элегаза может представлять интерес для получения фуллеренсодержащего сырья и нанопорошков, а также в реакторах сухого травления. Использование плазмохимического реактора на основе ПОР для синтеза материалов, которые используются в нанотехнологиях, имеет ряд преимуществ по сравнению с дуговым разрядом и лазерной плазмой.

Ресурс работы электроразрядных HF- и HD-лазеров в газостатических условиях сравнительно низкий $(10^2-10^3 \text{ импульсов})$ и определяется скоростью деградации молекул элегаза и пропана в плазме ПОР. Для поиска путей увеличения эффективности и ресурса работы

химических лазеров на нецепных реакциях необходимо более детальное экспериментальное изучение плазмы ПОР на основе смесей инертных газов с молекулами элегаза и пропана. Одним из возможных методов диагностики такой плазмы является спектроскопический метод излучения, который позволяет частично установить качественный состав плазмы и основные направления деградации молекул рабочей смеси. На первом этапе исследований было проведено изучение эмиссионных характеристик ПОР на основе пропана [6].

В настоящей статье представлены результаты исследования характеристик плазмы поперечного объемного разряда в смесях неона с молекулами элегаза и пропана.

Поперечный объемный разряд зажигался в ячейке из капролактама. Ячейка представляла собой цилиндр диаметром 4 и длиной 12 ст. Излучение регистрировалось из торцевого участка ячейки, которая отделялась от вакуумного монохроматора окном из LiF. Внутри ячейки установлены электроды ПОР длиной 10 ст с радиусом кривизны 4 ст. Межэлектродное расстояние в ячейке составляло 1.5 ст. Для УФ-предыонизации использовалась система из двух искровых линеек, установленных возле одного из электродов ПОР. Коммутатором в системе питания служил водородный тиратрон ТГИ1-1000/25. Основная и накопительная емкости LC-инвертора изготовлены из малоиндуктивных конденсаторов КВИ-3. Величина емкости накопительного и обострительного конденсаторов составляла 32 и 6.5 nF соответственно.

Излучение плазмы ПОР анализировалось в спектральном диапазоне 130—550 nm. Излучение поступало на входную щель вакуумного монохроматора с дифракционной решеткой на 1200 line/mm и обратной линейной дисперсией 0.7 nm/mm. Для детектирования излучения применялись фотоумножители ФЭУ-142 и ФЭУ-154, сигнал с которых поступал на усилитель постоянного тока и регистрировался на диаграммной ленте самописца. Частота следования импульсов возбуждения ПОР составляла 1—10 Hz. Осциллограммы импульсов напря-

жения и тока ПОР регистрировались с использованием малоиндуктивных калиброванных делителей и пояса Роговского, сигналы с которых поступали на вход быстродействующего импульсного осциллографа 6ЛОР-04.

Объем плазменной среды на смеси Ne-SF₆-C₆H₁₄ между электродами был минимальным в начальной стадии горения разряда на свежеприготовленной смеси. Разряд при этом имел ширину до 0.8 ст и светился отдельными 2-3 диффузными каналами (белофиолетового цвета), что определялось наличием в смеси электроотрицательного газа и что также нами ранее наблюдалось при исследовании ПОР в средах с элегазом. При содержании пропана в смеси 300-500 Ра и общем ее давлении $10-12\,\mathrm{kPa}$ после $(1-1.5)\cdot 10^3\,\mathrm{импульсов}$ цвет разряда определялся уже излучением синей полосы 468 nm молекулы $C_2(d-a)(5-6)$. Это указывает на образование значительного количества молекул углерода на высоковозбужденных колебательных уровнях электронных состояний d и a. После наработки $(3-5) \cdot 10^3$ импульсов ширина разряда уменьшалась до 0.4 ст.

Типичный спектр излучения плазмы ПОР в УФ-ВУФобласти на смеси неона с молекулами элегаза и пропана представлен на рис. 1. Он полностью определяется продуктами разрушения пропана, среди которых можно выделить соединения CH_2 , C_2H_2 , C_2H_4 , C_4H_2 и др. В качестве реперных полос, по которым возможно контролировать деградацию пропана по излучению плазмы в УФ-ВУФ-диапазоне длин волн могут быть выбраны полосы 182, 183, 193 и 248 nm. Яркости этих полос излучения уменьшались при увеличении содержания пропана в смеси.

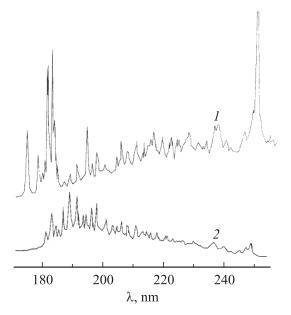


Рис. 1. Спектр излучения плазмы ПОР на смеси: I — Ne–SF $_6$ = 10.6–1.0, 2 — Ne–SF $_6$ -C $_6$ H $_{14}$ = 10.6–0.5–0.2 kPa.

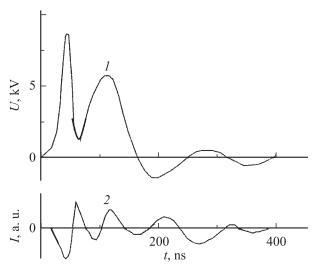


Рис. 2. Осциллограммы напряжения (*I*) и тока (*2*) ПОР на смеси $P(Ne)-P(SF_6)-P(C_6H_{14})=10.6-1.3-0.4\,kPa$ при зарядном напряжении основного накопительного конденсатора $8.5\,kV$.

На рис. 2 приведены типичные осциллограммы импульсов напряжения на разрядном промежутке и тока ПОР в смеси $Ne-SF_6-C_6H_{14}$. В диапазоне зарядных напряжений 4-10 kV при парциальных давлениях неона 3-12, элегаза 0.1-1.0 и пропана 0.1-0.3 kPa зажигался устойчивый ПОР. Длительность первой (основной) полуволны импульсов напряжения и тока находилась на уровне 50 ns. Максимальная пиковая величина тока ПОР достигалась на уровне 8-10 kA. По времени она была сдвинута относительно максимума первой полуволны напряжения между электродами на 40-50 ns. В эксперименте достигались пиковые мощности, которые вкладывались в плазму, в диапазоне 10-20 MW. В результате такой интенсивной накачки наблюдалось достаточно эффективное разрушение молекул элегаза и пропана, при этом все внутренние поверхности разрядной ячейки покрывались мелкодисперсной углеродистой пленкой черного цвета. После отработки на 5-7 смесях $P(Ne)-P(SF_6)-P(C_6H_{14}) =$ =(10...12)-(1.0...1.2)-(0.1...0.3) kPa в течение 1.5-2.0 h (на каждой свежеприготовленной смеси при $f = 10 \,\mathrm{Hz}$) выход углеродсодержащего сырья достигал 0.3-0.5 cm³.

Таким образом, исследование характеристик ПОР в смеси $Ne-SF_6-C_6H_{14}$ показало, что при умеренном зарядном напряжении ($U=4-10\,\mathrm{kV}$) пиковая электрическая мощность разряда достигает 20 МW, что приводит к распаду молекул элегаза и пропана вплоть до выпадения в осадок мелкодисперсного сырья, которое может представлять интерес для современных нанотехнологий. В качестве диагностических полос в УФ-ВУФ-диапазоне спектра могут быть использованы полосы продуктов распада пропана с длиной волны в максимуме при 193 и 248 nm.

Список литературы

- [1] Алексеев С.Б., Wang Lijum, Epoфеев М.В., Lin Jingru и др. // ПТЭ. 2003. № 2. С. 90–92.
- [2] Панченко А.Н., Орловский В.М., Тарасенко В.Ф. // ЖТФ. 2003. Т. 73. Вып. 2. С. 136–139.
- [3] *Ястремский А.Г., Ямпольский С.А.* // Изв. вузов. Физика. 1999. № 8. С. 63–66.
- [4] Аполлонов В.В., Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Сайфулин А.В. и др. // Квантовая электроника. 2001. Т. 31. № 7. С. 629–633.
- [5] Внуков А.В., Величко А.М., Мальцев К.К., Надейкин А.А., Никитин А.И. // Химическая физика. 1992. Т. 11. № 8. С. 1038–1048.
- [6] Шуаибов А.К., Сабов И.И., Гомоки З.Т., Шимон Л.Л. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 15. С. 35–39.